

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第5部門第1区分

【発行日】平成20年1月17日(2008.1.17)

【公開番号】特開2005-155631(P2005-155631A)

【公開日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【年通号数】公開・登録公報2005-023

【出願番号】特願2004-340295(P2004-340295)

【国際特許分類】

F 0 1 D 25/00 (2006.01)

F 0 2 C 7/00 (2006.01)

F 0 2 C 9/00 (2006.01)

G 0 1 N 21/63 (2006.01)

【F I】

F 0 1 D 25/00 X

F 0 2 C 7/00 A

F 0 2 C 9/00 A

G 0 1 N 21/63 A

【手続補正書】

【提出日】平成19年11月21日(2007.11.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0004】

従来、ガスターピン部品の被膜寿命を求めるることは、部品に対する保護金属被膜中のベータアルミニドの残留量を測定することを伴う。しかしながら、この方法は、エッティングして顕微鏡で光学的に観察してベータアルミニド領域の幅を測定することができるようになるため、構成部品の局部的切断及び関心領域の冶金的取り付けを必要とする。被膜中に残留するベータアルミニドの量は、アルミナ保護被膜の生成のために残留するアルミニウムの量を示しており、このようにして被膜寿命を求めるために使用される。

【特許文献1】米国特許第4543486号明細書

【特許文献2】米国特許第4634291号明細書

【特許文献3】米国特許第4677034号明細書

【特許文献4】米国特許第4818118号明細書

【特許文献5】米国特許第5216808号明細書

【特許文献6】米国特許第5742028号明細書

【特許文献7】米国特許第5847825号明細書

【特許文献8】米国特許第5885484号明細書

【特許文献9】米国特許第5932120号明細書

【特許文献10】米国特許第6005219号明細書

【特許文献11】米国特許第6008896号明細書

【特許文献12】米国特許第6075593号明細書

【特許文献13】米国特許第6149389号明細書

【特許文献14】米国特許第6159619号明細書

【特許文献15】米国特許第6197424号明細書

【特許文献16】米国特許第6283714号明細書

【特許文献17】米国特許第6380512号明細書

- 【特許文献 18】米国特許第 6452685 号 明細書
- 【特許文献 19】米国特許第 6488986 号 明細書
- 【特許文献 20】米国特許第 6532068 号 明細書
- 【特許文献 21】米国特許第 6629464 号 明細書
- 【特許文献 22】米国特許出願公開第 2003/0085203 号 明細書